

△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日	△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日
△	1		RE-F-10251		土井	小沢	05.02.02	△							
△								△							
適用規格															
定 格	使用温度範囲		-55℃～85℃				保存温度範囲		-10℃～60℃(注3)						
	電 圧		AC 100 V				使用湿度範囲		40 % ～ 80 %						
	電 流		0.4 A				保存湿度範囲		40 % ～ 70 % (注3)						
性 能															
	項 目		試 験 方 法				規 格				QT	AT			
構 造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○			
	表示		目視にて確認する。								○	○			
電 気 的 性 能	接触抵抗		100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。				80 mΩ以下(注1)				○	—			
	低電圧、低電流下の接触抵抗		20 mV以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。				100 mΩ以下(注2)				○	—			
	絶縁抵抗		DC 250 Vで測定する。				100 MΩ以上				○	—			
	耐電圧		AC 300 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	—			
機 械 的 性 能	繰り返し動作		50 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
	耐振性		周波数 10 ～ 55 Hz, 振幅 1.5 mm, 3 方向各 2 時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2)				○	—			
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2) ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上				○	—			
	温度サイクル		温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ 2～3 → 30→ 2～3 分を 5 サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
	塩水噴霧		濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下(注2)				○	—			
	硫化水素		濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)				② はなはだしい腐食がないこと。				○	—			
	はんだ耐熱性		リフローの場合: ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内 はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内				外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。				○	—			
	はんだ付け性		はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95 % 以上が新しいはんだでぬれていること。				○	—			
備考															
注1. 本製品のスタッキング高さ16mmタイプでの導体抵抗を考慮し、接触抵抗の初期値を80mΩとする。															
注2. 試験後、初期値からの変化量が20mΩ以下のこと。															
注3. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。															
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。															
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目															
製品名															
FX8C-※※P-SV2 (71)															
製品コード															
CL578															
1															
1															

